

# COATINGS

利用X射线荧光进行镀层厚度测量和材料分析

快速无损分析以确保您的持续生产和产品质量



处处精确到微米、微英寸，  
每一款机型都是微米或微英寸级精度

OXFORD  
INSTRUMENTS

*The Business of Science®*





# PRECISI

## COMPACT 系列 / MAXXI 系列

### 多功能性，高性价比

为您的分析要求提供最合适的产品系列

我们的镀层测厚仪是基于X射线荧光技术，该技术已经被证实并且得到广泛应用，可以在无须样品制备的情况下提供易于操作、快速和无损的分析。它能分析固体和液体，元素范围包括从元素周期表中的Ti22 到 U92。

#### 优势

- 超高的性价比
- 操作简单
- 高质量高可靠性的全日24小时/7天操作
- 快速的服务响应

**COMPACT Eco** 和 **MAXXI** 能提供目前最高的性价比，而 **COMPACT 5** 和 **MAXXI 5** 是既要满足最佳功能性又要满足最高检测精度的理想工具。

优化的X射线几何形状样品舱设计，使小准直器得到使用并能获得最佳精度和最高准确度。

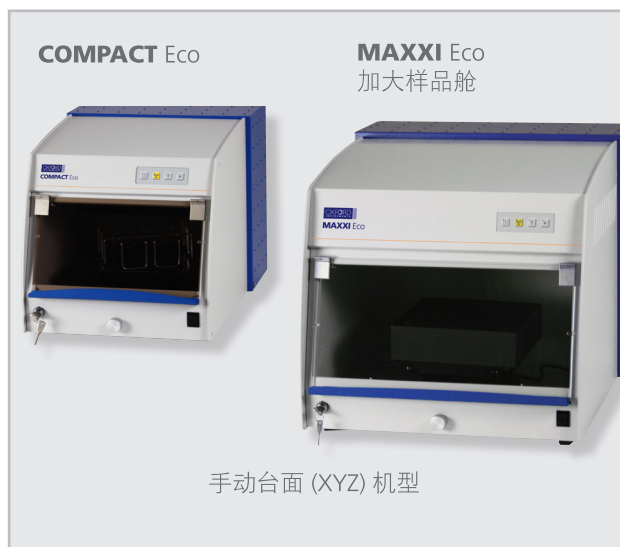
#### 无损检测只需几秒钟

- 为质量保证和过程控制提供单层或多层分析
- 合金成分的定量分析
- 用于优化电镀液控制的金属离子含量分析

#### 对于 **COMPACT 5** 和 **MAXXI 5** 的多选配置

- 不论样品尺寸大小都能得到最好的结果：带可编程X射线管电流控制的自动多准直器系统
- 自动化批量检测：XYZ软件控制程控台和最大灵活性的移动式测量头

最高性价比



符合ASTM B568 和ISO3497国际测试方法

# NANO-MASTER / CONTI 系统

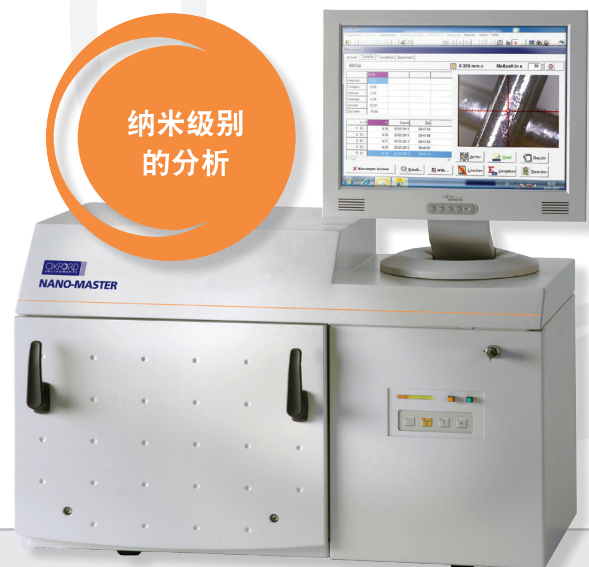
## 纳米级范围镀层测厚/在线测量

**NANO-MASTER** 是一种创新的  $\mu$ -XRF 台式分析仪器，它使用无标样方法，测量下限达到纳米级，可用于最新一代的极小电子元件和薄镀层测量。这款仪器具备极低的检测下限，并可以对元器件做 RoHS、WEEE、ELV 条例的符合性检测

### 亮点

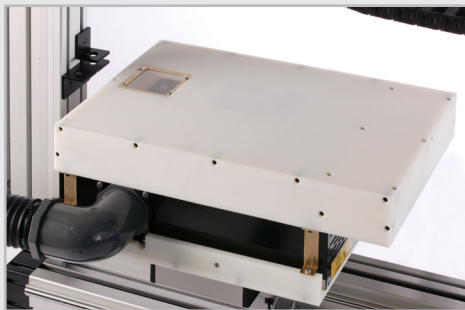
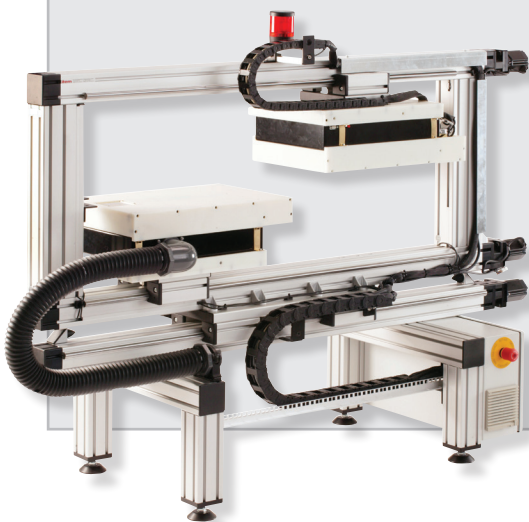
- 高分辨率的 Peltier 冷却 Si-PIN 探头可进行简单的元素识别
- HiSpex 数字脉冲处理器可在最短分析时间内处理极大 X 射线通量。
- 最小点分析的 X 射线束低至  $25 \mu\text{m}$  以下
- 真空测量舱使元素测量范围扩展到从  $\text{Al}^{13}$  到  $\text{U}^{92}$

纳米级别的  
分析



### CONTI 系统

对于在线测量，我们结合您的生产程序定制了 CONTI 系统。在分析各种可能性和限制条件后，我们将与您密切合作来开发、规划、执行和控制一个适用的系统。



利用 XRF 进行镀层测厚和材料分析

# X-Master

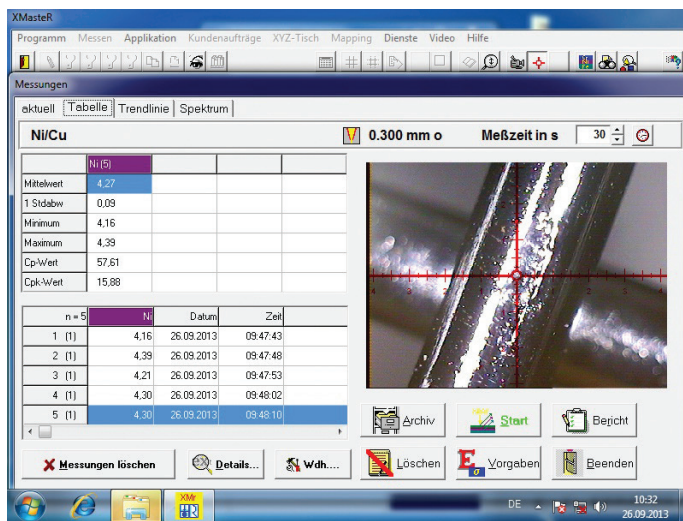
## 操作软件

### X-Master

**X-Master** 是一款具备庞大应用功能并被成功使用的软件，更多新的应用正不断的加进来。

### 可选软件模块

- **μ-Master** 用于镀层厚度测量
- **Report-Master** 用于微软报告文件
- **Element-Master** 用于材料分析
- **Data-Master** 用于数据库管理
- **%-Master** 用于材料分析（珠宝）
- **Liquid-Master** 用于电镀液分析



### 客户服务

#### 世界范围内的售后服务和客户支持

牛津仪器客户服务部门认识到并不是有了卓越的设备功能或者强大的仪器设计就足够。选择合适产品和合作伙伴同样非常重要。

我们的服务团队清楚地认识到运用我们深厚的知识、技能、经验和专业技巧为客户提供支持的必要性。快速、个性化服务是我们的强项。我们关注您。

更多信息欢迎联系我们：  
roentgenanalytik@oxinst.com  
+49 6128 9535-0

**Roentgenanalytik Systeme  
GmbH & Co.KG**  
An Oxford Instruments company

Georg-Ohm-Straße 6  
65232 Taunusstein  
Germany

中国  
电子邮箱：industrial@oxinst.com  
销售电话：400 6789 116

请访问 [www.roentgenanalytik.com](http://www.roentgenanalytik.com) 了解更多信息

This publication is the copyright of Oxford Instruments plc and provides outline information only, which (unless agreed by the company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or regarded as the representation relating to the products or services concerned. Oxford Instruments' policy is one of continued improvement. The company reserves the right to alter, without notice the specification, design or conditions of supply of any product or service. Oxford Instruments acknowledges all trademarks and registrations. © Oxford Instruments plc, 2013. All rights reserved. Part no: OIIA/116/0214



*The Business of Science®*

